



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ  
СОЮЗА ССР

# ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ

ГОСТ 19834.0—75,

ГОСТ 19834.2-74 — ГОСТ 19834.5-80

(СТ СЭВ 3788—82)

Издание официальное

Цена 10 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****ИЗЛУЧАТЕЛИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ****Общие требования при измерении параметров**

Semiconductor emitters.  
General requirements for measurement  
of parameters

ОКП 621000

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров ССР от 14 февраля 1975 г. № 433 срок действия установлен**

**с 01.07.76****до 01.07.87****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на полупроводниковые излучатели некогерентного излучения (далее—излучатели), в том числе бескорпусные, и устанавливает общие требования при измерении параметров.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 3788—82 в части общих положений (см. справочное приложение 2).

**2. УСЛОВИЯ И РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ**

2.1. Условия при измерении параметров излучателей — по ГОСТ 20.57.406—81.

2.2. Электрический режим измерения должен соответствовать установленному в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

**3. АППАРАТУРА**

3.1. Аппаратура — по нормативно-технической документации и стандартам на конкретные методы измерения со следующим дополнением.

3.1.1. Измерительные установки должны обеспечивать исключение влияния посторонних засветок на результат измерений. Пог-

**Издание официальное****Перепечатка воспрещена**

\* Переиздание (апрель 1985 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1983 г., Пост. № 5736 от 06.12.83 (ИУС 3—84).

© Издательство стандартов, 1985

**ГОСТ**  
**19834.0—75\***  
**(СТ СЭВ 3788—82)**

решности за счет контактных соединений при измерении параметров бескорпусных излучателей следует учитывать в стандартах на конкретные методы измерения.

3.1.2. Положение излучателя и фотоприемника должно обеспечивать измерение параметров в направлении геометрической оси корпуса излучателя для корпусных приборов и в направлении, перпендикулярном излучающей поверхности, для бескорпусных излучателей, в том числе для излучающих структур на пластинах.

3.1.3. При наличии в конструкции излучателя оптических элементов, изменяющих пространственную структуру излучения (линз, световодов, фоконов и т. п.), дополнительные требования должны соответствовать указанным в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

3.1.4. В качестве образцовых и рабочих источников излучения следует использовать светоизмерительные лампы накаливания и светоизмерительные лампы с ленточным телом накала по ГОСТ 8.023—83 и ГОСТ 8.101—80, образцовые излучатели и контрольные образцы на основе излучателей, имеющих известную относительную спектральную плотность энергии излучения.

3.1.5. В качестве фотоприемника следует использовать фотоэлектронные умножители, фотоэлементы и фотоэлектрические полупроводниковые приемники излучения, чувствительные во всем диапазоне измерения измеряемого параметра и отградуированные по спектральной чувствительности.

3.1.6. Чувствительность фотоприемника должна быть постоянной в пределах допустимой погрешности во всем диапазоне измерения измеряемого параметра.

3.1.7. При импульсных режимах измерения фотометрических и статических параметров следует учитывать динамические параметры фотоприемника и инерционные свойства излучателя. Длительность импульса прямого тока должна превышать не менее чем в 50 раз длительность переходных процессов в излучателе и фотоприемнике. Длительность, амплитуда и частота следования импульсов прямого тока должны соответствовать установленным в стандартах или технических условиях на излучатели конкретных типов.

3.1.8. Для измерения параметров матричных излучателей следует предусматривать возможность применения автоматизированных измерительных установок, в том числе с ЭВМ.

1—3.1.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).

4—6. (Исключены, Изм. № 1).

Приложение справочное. (Исключено, Изм. № 1).

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

*Справочное*

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ  
о соответствии ГОСТ 19834.0—75 СТ СЭВ 3788—82**

Пункты ГОСТ 19834.0—75	Пункты СТ СЭВ 3788—82
п. 3.1.1	п. 1.1.3.4
п. 3.1.2	п. 1.1.3.2
п. 3.1.3	п. 1.1.2.5
п. 3.1.5	п. 1.1.2.3
п. 3.1.7	п. 1.1.2.8

**(Введено дополнительно, Изм. № 1).**

**Изменение № 2 ГОСТ 19834.0—75 Излучатели полупроводниковые. Общие требования при измерении параметров**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 01.06.87 № 1783**

**Дата введения 01.10.87**

Пункт 2.1 изложить в новой редакции: «2.1. Измерения параметров излучателей следует проводить в нормальных климатических условиях по ГОСТ 20.57.406-81 или условиях, установленных в стандартах на конкретные методы измерения».

Пункт 3.1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8.023—83 на ГОСТ 8.023—86.

Стандарт дополнить разделом — 4:

**«4. Требования безопасности**

4.1. Аппаратура, применяемая для измерения электрических параметров излучателей, должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0—75, ГОСТ

*(Продолжение см. с. 420)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19834.0—75)*

12.1.030—81 и «Правилам устройства электроустановок», утвержденным Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР.

4.2. Обслуживание установок должно быть возложено на специально подготовленный технический персонал и производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004—79, ГОСТ 12.3.019—80, «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Главгосэнергонадзором Минэнерго СССР.

4.3. Для предупреждения пожаро- и взрывоопасности необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.1.004—85 и «Типовые правила пожарной безопасности для промышленных предприятий», утвержденные МВД СССР.

*(ИУС № 9 1987 г.)*